

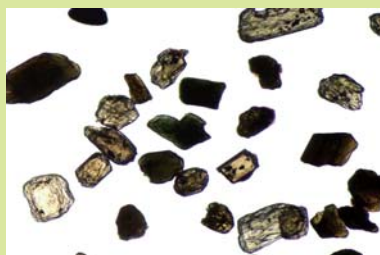
# 胎土分析

胎土分析には、現在様々な分析方法が用いられているが、大きく分けて鉱物組成や岩片組成を求める方法と化学組成を求める方法とがある。前者は粉碎による重鉱物分析や切断による薄片作製などが主に用いられており、後者では蛍光X線分析が最もよく用いられる。一般には、比較的粗粒の砂粒を含み、低温焼成と考えられる土器の分析では、重鉱物分析を用いることが多い。重鉱物分析は、胎土の特徴が捉えやすいこと、地質との関連性を考えやすいことなどの利点がある。また、薄片観察は、胎土中における砂粒の量はもちろんのこと、その粒径組成や砂を構成する鉱物、岩石片および微化石の種類なども捉えることが可能であり、得られる情報は重鉱物分析よりも多い。一方、蛍光X線分析は、胎土中の砂粒だけではなく、素地を作っている粘土も含めた特性を表しており、また、機器分析による数値データで表されることから、客観性、再現性がよいということがある。当社では、重鉱物分析、薄片作製、蛍光X線分析による胎土分析を土器の種類や目的に応じて実施している。

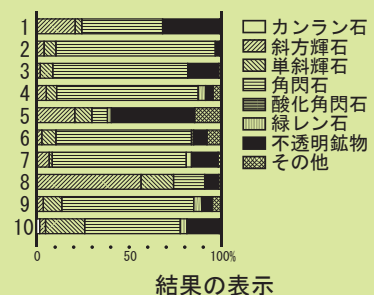
## <胎土重鉱物分析>



重液分離



プレパラート内の状況



結果の表示

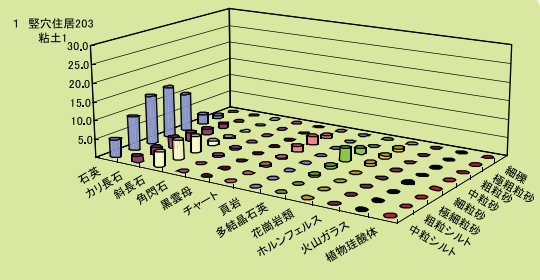
## <胎土薄片作製観察>



薄片作製



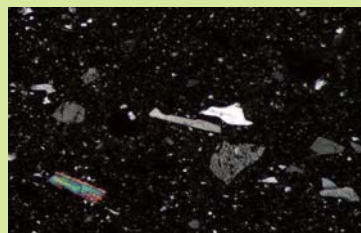
薄片の状況(開放ニコル)



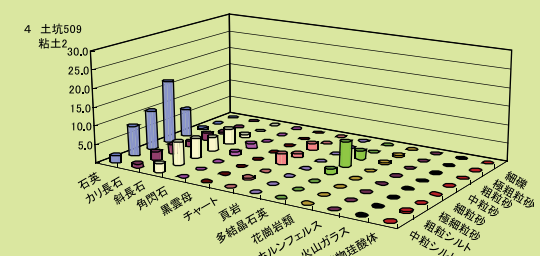
結果の表示



顕微鏡観察



薄片の状況(直交ニコル)



結果の表示

## <胎土蛍光X線分析>



分析装置

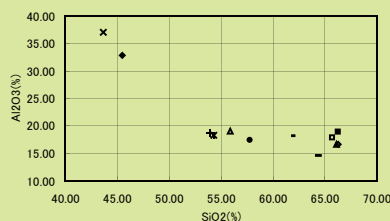


図1. SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>散布図

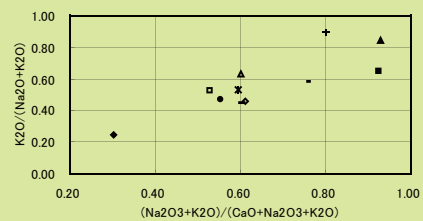


図2. 長石類主要元素の散布図

結果の表示